

01; 03; 12

© 1993

О КЛАССИФИКАЦИИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

С.О. Ширяева, А.И. Григорьев,
Л.С. Подвальныи

В связи с широким использованием явления электростатического диспергирования жидкостей в современных технологиях, технических устройствах и научных приборах (см., например, [1-3]) в последние годы заметно увеличился интерес к исследованию физической природы этого явления. В ряде экспериментальных исследований было показано, что в зависимости от физико-химических свойств жидкости, геометрических и физических параметров устройства для диспергирования, можно выделить на феноменологическом уровне более десятка возможных режимов реализации этого явления [3-8]. Собственно говоря, уже исходные экспериментальные исследования, выполненные еще в начале века [9], указали на нетривиальность и большое разнообразие каналов проявления электрической неустойчивости заряженной поверхности жидкости, лежащей в основе ее электростатического диспергирования. Попытки выделения и простейшей классификации возможных режимов предпринимались неоднократно. В основу такой процедуры чаще всего закладывались чисто визуальные различия [4, 6, 8-9], в более глубоких исследованиях деление производилось на основе сравнения визуальной картины с какой-либо физической характеристикой жидкости [5, 7], а в последних публикациях визуальная картина сравнивается с особенностями вольт-амперной характеристики явления [3]. В этом ряду выделяется работа [10], в которой разделение по режимам проведено на основе анализа физико-химических характеристик диспергируемой жидкости путем сравнения трех характерных времен: $\tau_{\mathcal{E}} \equiv \mathcal{E} \cdot \mathcal{E}_0 / \sigma$ – времени релаксации электрического заряда; $\tau_{vR} \equiv R^2 / \nu$ – времени вязкой релаксации жидкого мениска, с которого происходит эмиссия капелек; $\tau_{v,r} \equiv r^2 / \nu$ – времени вязкой релаксации эмиттированной капельки. Кроме того, учитывалось и характерное время натекания жидкости в объем эмиттированной капельки: $\tau_m \equiv m / \dot{M}$, характеризующее устройство диспергирования. В приведенных формулах: \mathcal{E} , σ и ν – диэлектрическая проницаемость, удельная электропроводность и кинематическая вязкость жидкости; r и m – радиус и масса эмиттируемой капельки; R – радиус жидкого мениска на вершине капилляра, по которому жидкость подается в разрядную систему; \dot{M} – массовая скорость течения жидкости через капилляр; \mathcal{E}_0 – электрическая постоянная. На основе этих четырех времен в [10] описаны три режима электродиспергирования.

Работы [11, 12] указали на возможность выделения режимов диспергирования на основе сравнения сил, действующих на капельку, отрывающуюся от мениска. Поскольку в общем случае эмиттируемую капельку отрывают три силы: сила тяжести F_g , сила электрического отталкивания заряда капельки от капилляра F_v и сила гидродинамического давления F_v , то представляется целесообразным грубое разбиение на режимы проводить в соответствии с тем, какая из сил преобладает в имеющейся их комбинации. Каждый из режимов, полученных таким образом, следует делить на подрежимы в соответствии с физико-химическими свойствами диспергируемой жидкости на основе сравнения характерных времен: τ_{ξ} – времени релаксации электрического заряда; $\tau_v \equiv R/c$ – времени вязкой релаксации в жидком мениске; $\tau_c = R/c$ – времени гидродинамической релаксации мениска или характерного времени выравнивания давлений в мениске (здесь c – скорость звука в жидкости). Помимо времен, характеризующих релаксационные процессы в жидкостях, при выделении режимов следует также учитывать технологические времена:

$$\tau_V \equiv \frac{2}{3} \frac{\sqrt{\gamma} R^3}{\dot{V}}$$

– характерное время натекания жидкости в полусферический мениск (\dot{V} – объемный расход жидкости);

$$\tau_\alpha \equiv \left(\frac{\rho \cdot R^3}{\alpha \cdot (1-W)} \right)^{1/2}$$

– характерный период капиллярных колебаний мениска при $W \equiv \frac{\epsilon_0 \epsilon_{cp} U^2}{16 \alpha R} < 1$, где U – потенциал капилляра, α – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, ϵ_{cp} – диэлектрическая проницаемость среды;

$$\tau_\alpha^y \equiv \left(\left[\frac{\alpha}{\rho R^3} (W-1) \right]^{1/2} - \frac{y}{R^2} \right)^{-1}$$

– характерное время развития капиллярной неустойчивости в мениске при $W > W_* \equiv 1 + \frac{\rho y^2}{\alpha R}$;

$$\tau_v^\alpha \equiv \left(\frac{y}{R^2} - \left[\frac{\alpha}{\rho R^3} (W-1) \right]^{1/2} \right)^{-1}$$

Капельный режим (Dripping mode)

$$F_v < F_u \ll F_g$$

$$W \sim 0 : \tau_\varepsilon < \tau_\alpha < \tau_v < \tau_\nu$$

$$0 < W < 1 : \tau_\varepsilon < \tau_v \leq \tau_\alpha < \tau_\nu$$

$$1 < W < W_* : \tau_\varepsilon < \tau_v < \tau_\nu^\alpha$$

7

Струйно-капельный режим (Jet-dripping mode)

$$F_v < F_u \leq F_g$$

$$W > W_* : \tau_\varepsilon \approx \tau_\alpha^\nu < \tau_v < \tau_\nu$$

7

Веретенообразный режим (Spindle mode)

$$F_v < F_g \ll F_u$$

$$\tau_\alpha^\nu < \tau_\varepsilon < \tau_v < \tau_\nu$$

7

Микрокапельный режим (Microdripping mode)

$$F_v \leq F_g \ll F_u$$

$$\tau_\alpha^\nu < \tau_\varepsilon < \tau_v \approx \tau_\nu$$

▽

Конусно-короткоструйный режим (Cone-short jet mode)

$$F_v \sim F_g \ll F_u$$

$$\tau_\alpha^\nu \ll \tau_\varepsilon < \tau_\nu \approx \tau_v$$

Рис. 1. Диаграмма смены режимов, реализующихся при электродиспергировании маловязких жидкостей: $\tau_c \leq \tau_\varepsilon \ll \tau_v$.

Капельный режим с длинной перетяжкой (Dripping mode – long neck)

$$F_v \ll F_u \ll F_g$$

$$W < 1 : \tau_v^\alpha < \tau_\varepsilon \ll \tau_v$$

↓
7

Прерывистый конусно-струйный режим (Intermittent cone-jet mode)

$$F_v \sim F_g < F_u$$

$$\tau_v^\alpha \approx \tau_\varepsilon \ll \tau_v$$

↓
7

Конусно-длиноструйный режим (Cone-long jet mode)

$$F_v \sim F_g \ll F_u$$

$$\tau_\varepsilon < \tau_v^\alpha < \tau_v$$

Рис. 2. Диаграмма смены режимов, реализующихся при электродиспергировании вязких жидкостей: $\tau_c < \tau_v \leq \tau_\varepsilon$.

– характерное время затухания капиллярных волн в мениске при $1 < W < W_*$. Заметим, что условие $W < W_*$ аналогично требованию, накладываемому на величину вязкости жидкости $\nu > \left[\frac{\alpha R}{\rho} (W-1) \right]^{1/2}$.

В качестве иллюстрации применения предлагаемого набора характерных времен приведем на рис. 1 и рис. 2 диаграммы, описывающие последовательные смены режимов, реализующихся при постепенном увеличении электрического потенциала, приложенного к капилляру, по данным экспериментальных работ [4, 13–16] с маловязкими и вязкими жидкостями. Стрелки на диаграммах указывают направление смены режимов при увеличении потенциала, приложенного к капилляру. Отметим, что переход от веретенообразного режима (Spindle mode) к микрокапельному (microdripping mode) на рис. 1 может быть осуществлен без увеличения потенциала, путем уменьшения объемного расхода жидкости.

Следует отметить, что последовательности смены режимов, представленные на рис. 1, 2, не были прослежены в указанном порядке на одной установке при постепенном увеличении потенциала, но составлены по данным различных экспериментальных исследований, выполненных на несхожих установках с различными жидкостями. Авторы данной заметки с сожалением отмечают, что, несмотря на обилие экспериментальных исследований по электродиспергированию различных жидкостей, все имеющиеся экспериментальные данные невозможно увязать в единую систему из-за неполного описания экспериментальных установок и из-за частого отсутствия контроля физико-химических свойств распыливаемых жидкостей: многие авторы работали со смесями различных жидкостей, не измеряя их физико-химических характеристик. И, тем не менее, предложенный набор характерных времен и имеющиеся экспериментальные данные позволяют прогнозировать на качественном уровне результаты электродиспергирования жидкости с заданными физико-химическими свойствами при заданных технологических условиях.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Дудников В.Г., Шабалин А.Л. Электрогидродинамические источники ионных пучков. Обзор. // Препринт 87-63 ИЯФ СОАН СССР. Новосибирск. 1987. 66 с.
- [2] Grigoriev A.I., Shiryaeva S.O., Verbitski S.S. // J. Coll. Int. Sci. 1991. V. 146, N 1. P. 139-151.
- [3] Краснов Н.В., Мурадымов М.З., Шевченко С.И. // Научное приборостроение. 1991. Т. 1. В 1. С. 42-51.
- [4] Cloquerau M., Prunet-Foch B. // J. of Electrostatics. 1990. V. 25. P. 165-184.
- [5] Бураев Т.К., Верещагин И.П., Пашин М.М. Сб.: Сильные электрические поля в технологических процессах. М.: Энергия, 1979. № 3. С. 87-105.
- [6] Григорьев А.И., Синкевич О.А. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. № 3. С. 182-187.
- [7] Drozbin V.G. // J. Coll. Sci. 1955. V. 10, N 2. P. 158-164.
- [8] English W.N. // Phys. Rev. 1948. V. 74, N 2. P. 179-189.
- [9] Zeleny J. // Phys. Rev. 1914. V. 3, N 2. P. 69-91.
- [10] Pfeiffer R.J. // Phys. of Fluids. 1973. V. 16, N 3. P. 454-455.
- [11] Woosley J.F., Turnbull R.J., Kim K. // J. Appl. Phys. 1988. V. 21 P. 4278-4284.
- [12] Sample S.B., Raghupathy B. // J. Coll. Int. Sci. 1971. V. 41, N 2. P. 185-193.

- [13] C a r s o n R.S., H e n d r i c s C.D. // AIAA Journal. 1965. V. 6. P. 1072-1075.
- [14] H e n d r i c s C.D. et al // Ракетная техника и космонавтика 1964. № 4. С. 189-194.
- [15] К о ж е н к о в В.И., К и р ш А.А., Ф у к с Н.А. // Коллоидный журнал. 1974. Т. 36. № 4. С. 1168-1171.
- [16] H a u a t i L, B a i l y A.I. // J. Coll. Int. Sci. 1987. V. 117. N 1. P. 222-230.

Поступило в Редакцию
25 января 1993 г.